

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2023年9月28日(28.09.2023)



(10) 国際公開番号

WO 2023/181754 A1

(51) 国際特許分類:
G01R 1/067 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2023/006204

(22) 国際出願日: 2023年2月21日(21.02.2023)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2022-047137 2022年3月23日(23.03.2022) JP

(71) 出願人: 株式会社日本マイクロニクス(KABUSHIKI KAISHA NIHON MICRONICS)
[JP/JP]; 〒1808508 東京都武蔵野市吉祥寺本町2丁目6番8号 Tokyo (JP).

(72) 発明者: 岸 康貴(KISHI Yasutaka); 〒1808508 東京都武蔵野市吉祥寺本町2丁目6番8号 株式会社日本マイクロニクス内 Tokyo (JP).

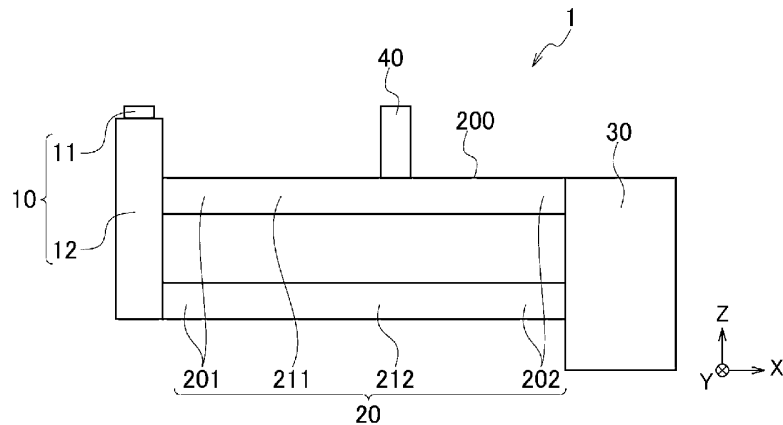
(74) 代理人: 三好 秀和, 外(MIYOSHI Hidekazu et al.); 〒1050001 東京都港区虎ノ門一丁目2番8号 虎ノ門琴平タワー Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG,

(54) Title: PROBE, PROBE-HOLDING DEVICE, AND METHOD FOR MANUFACTURING PROBE

(54) 発明の名称: プローブ、プローブ保持装置およびプローブの製造方法



(57) Abstract: This probe has a distal-end part, an arm part, a support part, and a guide part. The distal-end part has a contact section that comes into contact with a body to be inspected. The arm part is a cantilever structure having a connecting arm for linking a free end and a fixed end, the free end being connected to the distal-end part. The support part is connected to the fixed end. The guide part is connected to an installation region on the arm part facing in a distal-end direction in which the body to be inspected is positioned as viewed from the contact section, the guide part protruding farther in the distal-end direction than the installation region.

[続葉有]



WO 2023/181754 A1

ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類：

一 国際調査報告（条約第21条(3)）

(57) 要約：プローブは、先端部、アーム部、支持部およびガイド部を有する。先端部は、被検査体に接触する接触部を有する。アーム部は、自由端と固定端を連結する接続アームを有するカンチレバー構造であり、自由端が先端部に接続する。支持部は、固定端に接続する。ガイド部は、接触部から見て被検査体が位置する先端方向に向いたアーム部の設置領域に接続し、設置領域よりも先端方向に突出する。